

走査型電子顕微鏡（平成一三年製）

機械器具や電子部品などの微細構造の観察

【型式】

（株）日立製作所 S-3000N

【仕様】

観察倍率：×15～×300,000(65段)，加速電圧：0.3～30kV(1171段)，

分解能：3.5nm(高真空)，4.5nm(低真空)，最大試料サイズ：直径150mm，

エネルギー分散型X線分析装置：EDAX Genesis (SSD)

【設置年度】

2000年度（平成12年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日